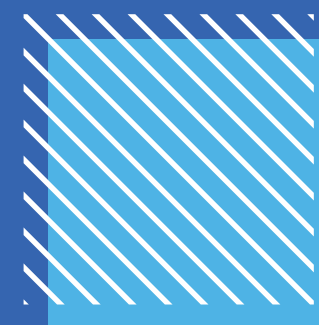
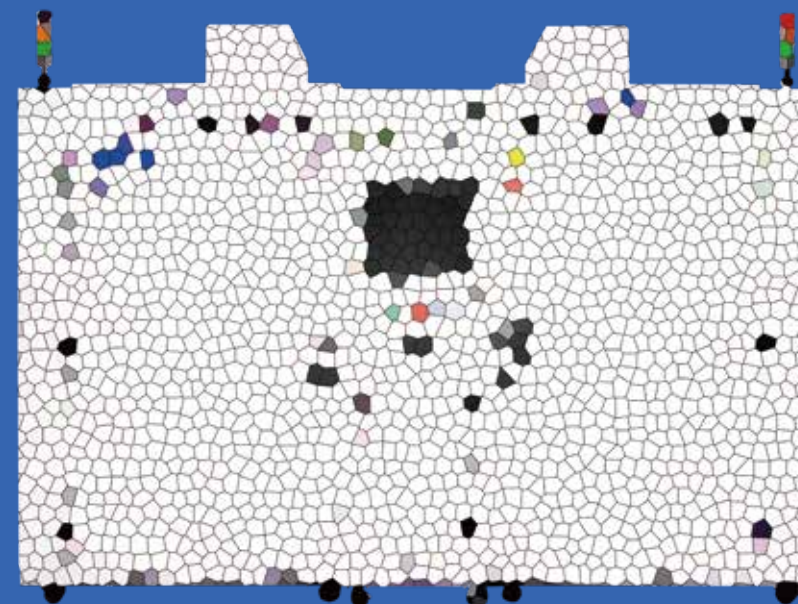


ATiS®



超大规模集成电路老化测试系统

LSIC burn-in test system



www.hkyq.com.cn

浙江杭可仪器有限公司
浙江省杭州市萧山区鸿达路157号
电话：0571-86451253
传真：0571-82697879
邮箱：atis@hkyq.com.cn



LSIC7000

超大规模集成电路老化测试系统

LSIC burn-in test system

LSIC7000

16 ZONE/32 SLOTS

该系统支持双温区，可进行室温+10℃~150℃的HTOL老化测试，老化过程中实时检测被测器件的输出信号，过程中自动对比向量。

- 每块老化板提供8路可编程电源 (0.5~6.0V/25A), 电源规格可单独定制
- 每块老化板可提供, 184路数字信号, 其中32路为双向I/O
- 每个试验箱可支持最大4KW的热耗散
- 支持STIL、VCT、VEC格式向量文件直接导入使用
- 支持芯片BIST测试
- 完全兼容DL601H机台的老化板, 可即插即用
- 充分的实验员人体安全考虑设定

LSIC7000 产品特性

试验温区	2个
试验温度	室温+10℃~+150℃
老化试验区	16 区/32 槽位
数字信号频率	12.5MHz
向量深度	16Mbit
信号通道数	184路(其中32路双向I/O)
时钟组数	8组
信号周期	80~20480nS
时序边沿	双沿
PIN格式	8种
信号输入输出电压	0.5~5V
I/O驱动电流	DC=50mA、瞬时电流≥80mA
DPS电源	0.5~6.0V/25A (可选配10V/5A)
DPS电源数	8个 (可根据客户需求配置)
DPS输出保护	OVP(过压)、UVP(欠压)、OCP(过流)
整机供电	三相AC380V±38V
最大功率	35KW (典型)
整机重量	1600Kg (典型)
整机尺寸	3200mm(W)x1675mm(D)x2370mm(H)

适用标准

MIL-STD-883 MIL-STD-38510 AEC-Q101 JESD22A-108

适用器件

适用于通用超大规模集成电路、SOC、FPGA、ARM、AI、低功耗GPU等超大规模集成电路



LSIC9000

超大规模集成电路老化测试系统

LSIC burn-in test system

LSIC9000

32 ZONE

该系统可对芯片进行室温+10℃~150℃的HTOL测试，老化过程中实时检测被测器件的输出信号，过程中自动对比向量。

- 每块老化板提供10路可编程电源(0.5~6.0V/25A)，电源规格可单独定制
- 每块老化板可提供，256路I/O双向通道
- 每个试验箱可支持最大38KW的热耗散
- 支持STIL、VCT、VEC格式向量文件直接导入使用
- 支持芯片BIST测试
- 最大支持24个工位独立温控
- 充分的实验员人体安全考虑设定

LSIC9000 产品特性

试验温区	1个
试验温度	室温+10℃~+150℃
老化试验区	32区
数字信号频率	10MHz
向量深度	16Mbit
信号通道数	256路独立可编程双向I/O
时钟组数	8组
信号周期	80~20480nS
时序边沿	双沿
PIN格式	8种
信号输入输出电压	0.5~5V
I/O驱动电流	DC>100mA、瞬时电流>200mA
DPS电源	0.5~6.0V/25A (可选配10V/10A, 6V/50A)
DPS电源数	10个(可根据客户需求配置)
DPS输出保护	OVP(过压)、UVP(欠压)、OCP(过流)
整机供电	三相AC380V±38V
最大功率	100KW (典型)
整机重量	2200Kg (典型)
整机尺寸	2800mm(W)x1480mm(D)x2310mm(H)

适用标准

MIL-STD-883 MIL-STD-38510 AEC-Q101 JESD22A-108

适用器件

适用于通用超大规模集成电路、SOC、FPGA、ARM、AI、低功率GPU等超大规模集成电路



浙江杭可仪器有限公司(ATIS HangKe)，总部位于中国杭州，是一家有着悠久历史传承和丰富技术沉淀的高端装备制造企业。公司专注半导体可靠性测试及特种电源领域，是专业的测试方案提供者、高效的测试系统服务者、领先的电子电源设备研制者。

自创设以来，公司始终紧贴客户需求，坚持独立研发，经过数十年的创新积累，现已拥有涵盖全系列电子元器件的老化筛选设备及测试系统，并承接多项国家重点工程配套任务，凭借优异的品质屡获某部嘉奖。

公司现有员工近300人，专业技术人员占比超过50%，专利储备68项，研发能力多次荣获省部级科技进步奖项。成熟的销售体系及卓越的售后团队能够快速响应客户需求，产品及服务触达全国，深受众多客户的长期肯定。

杭可仪器秉承“高质、高效、高速”的稳健发展策略，深耕半导体行业，坚持以质量立身、以技术驱动、以客户为中心，积极探索更新的技术、更优的产品和更好的服务。锐意进取的我们，本着开放、合作、共好的商业理念，愿与行业内外的有识之士一道，为“追求科技进步、振兴民族产业”而奋斗不息。

ATiS®

半导体可靠性测试行业领军企业

浙江杭可仪器有限公司
杭州市萧山区鸿达路157号
www.hkyq.com.cn
0571-86451253